

Información Logística

- Del 2 al 6 de Marzo de 2015.
- Dirección: Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Servicio de Microscopía, Campus de Bellaterra - 08193 Bellaterra (Barcelona).
- Nº de días: 5
- Las sesiones prácticas incluyen trabajar con microscopía confocal e interferométrica Leica DCM.
- Valor de la inscripción: 600 Euros.
- Dicho pago incluye documentación, material de prácticas, comidas, coffee breaks y la cena del curso.
- Los interesados deberán solicitar reserva de plaza rellenando el formulario de pre-inscripción on-line en la web <http://sm.uab.es>. Para cualquier consulta, podrán dirigirse por fax o email a: Servicio de Microscopía de la UAB
Atención: Esperanza Ramírez
Tel.: 93 581 15 16
Fax: 93 581 20 90
E-mail: s.microscopia@uab.es
- Dado que el número de plazas está limitado a 12 personas, éstas se reservarán por riguroso orden de inscripción. Cada persona recibirá acuse de recibo tras su inscripción. El pago se efectuará con anterioridad al 2 de febrero mediante transferencia bancaria.
- Alojamiento: caso de requerirlo, pueden efectuar reserva de hotel a través de la agencia de viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona enviando un e-mail a uab@viajeseci.es con la referencia "curso confocal Leica", pudiendo en este caso acogerse a las tarifas universitarias.

Profesores

Dionís Díez, Leica Microsistemas S.L.
Óscar Rodríguez, Leica Microsistemas S.L.
Mònica Roldán, Servicio de Microscopía, UAB
Emma Rossinyol, Servicio de Microscopía, UAB

Conferenciantes

Jordi Díaz, Centres Científics i Tecnològics. UB
M^a José Esplandiú, Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología, CIN2 (ICN-CSIC)

Colaboran

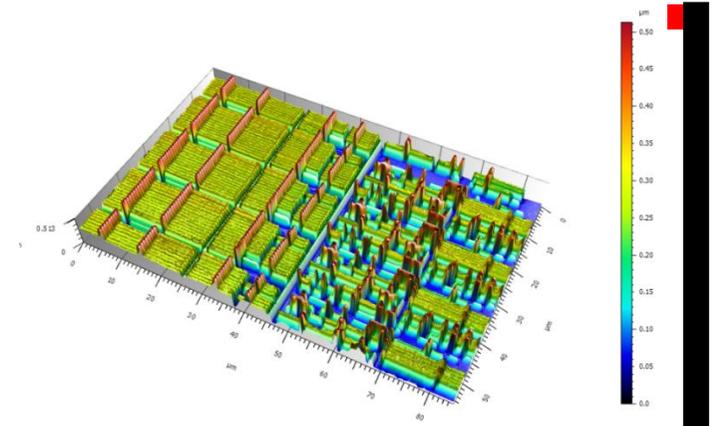
Irati Golvano, Servicio de Microscopía. UAB
Laura Olomi, Leica Microsistemas S.L.
Esperanza Ramírez, Servicio de Microscopía. UAB
Meritxell Vendrell, Servicio de Microscopía. UAB

Coordinadores del curso:

Óscar Rodríguez, Leica Microsistemas S.L.
Onofre Castell, UAB
Mònica Roldán, UAB

Leica Microsistemas, S.L.
C/ Nicaragua, 46
08029 Barcelona
Tel. +34 93 494 95 55
Fax +34 93 494 95 32

Servei de Microscòpia
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 581 15 16
Fax +34 93 581 20 90



I Curso de metrología superficial para usuarios de sistemas Leica DCM

Del 2 al 6 de Marzo de 2015

Centro de formación en microscopía confocal Leica.
Servicio de Microscopía de la Universidad Autónoma de Barcelona



Living up to Life

Leica
MICROSYSTEMS

Información General

Objetivos del Curso:

Es un curso para usuario de microscopía confocal de reflexión e interferométrica Leica DCM. Combina sesiones teóricas y prácticas en aras de proporcionar los conocimientos básicos necesarios para una adecuada utilización de dichas técnicas instrumentales y aplicadas al análisis metrológico superficial. Durante las sesiones de observación de muestras, los alumnos tendrán la posibilidad de analizar sus propias muestras.

¿A quién está dirigido?

Este curso está destinado a todas aquellas personas que vayan a utilizar o estén utilizando un microscopio confocal e Interferométrico Leica DCM, y deseen adquirir/ampliar sus conocimientos teórico-prácticos sobre el mismo. Es recomendable que los participantes tengan unos conocimientos básicos de la microscopía óptica.

¿Quiénes constituyen el cuadro de profesores? Todos ellos utilizan la microscopía confocal e interferométrica tanto en sus áreas aplicativas como técnicas y están especializados en campos muy diversos.

Lunes 2 de Marzo de 2015

11:45 **Recogida de acreditaciones y documentación del curso**

12:00 **Bienvenida.** Mònica Roldán

12:30 **Fundamentos de la microscopía óptica.** Dionís Díez

14:00 Comida

15:00 **Microscopía Confocal y Leica DCM.** Óscar Rodríguez

16:00 Sesión práctica: **Fundamentos Ópticos.**

Dionís Díez/Óscar Rodríguez

17:00 Fin de la sesión

Martes 3 de Marzo de 2015

09:30 **Adquisición en Leica DCM.** Dionís Díez

10:30 Coffee Break

11:00 Sesión práctica: **Adquisición en Leica DCM.**

Dionís Díez/Óscar Rodríguez

13:00 **Aplicaciones de la microscopía Confocal e Interferométrica.** Óscar Rodríguez

14:00 Comida

15:00 **Análisis de Rugosidad.** Dionís Díez

16:00 Sesión práctica: **Análisis de la Rugosidad.**

Óscar Rodríguez/Dionís Díez

17:00 Fin de la sesión

Miércoles 4 de Marzo de 2015

09:30 **Análisis en Leica DCM.** Óscar Rodríguez

10:30 Coffee Break

11:00 Sesión práctica: **Análisis en Leica DCM I.**

Dionís Díez/Óscar Rodríguez

13:00 **Interferometría y Leica DCM.** Dionís Díez

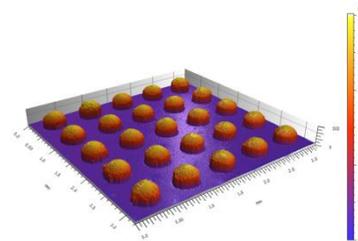
14:00 Comida

15:00 Sesión práctica: **Interferometría.**

Dionís Díez/Óscar Rodríguez

17:00 Fin de la sesión

21:00 Cena del curso



Jueves 5 de Marzo de 2015

09:30 Conferencia: **“La microscopía confocal de fluorescencia aplicada al estudio de materiales”.** Mònica Roldán

10:30 Coffee Break

11:00 Sesión práctica: **Análisis en Leica DCM II.**

Dionís Díez/Óscar Rodríguez

13:00 Conferencia: **“Aplicaciones de confocal DCM 3D en polímeros y pinturas”.** Emma Rossinyol

14:00 Comida

15:00 Sesión práctica: **Análisis de muestras de los participantes.**

O. Rodríguez/D. Díez/E. Rossinyol/M. Roldán

17:00 Fin de la sesión

Viernes 6 de Marzo de 2015

09:30 Sesión práctica: **Análisis en Leica DCM III.**

Dionís Díez/Óscar Rodríguez

10:30 Coffee Break

11:00 Conferencia: **“Aplicaciones de la microscopía óptica avanzada en el campo de la odontología”.** Jordi Díaz

11:30 Conferencia: **“Nanoactuadores impulsados por reacciones catalíticas”.** M^a José Esplandiú

12:00 Conferencias: **“Textura Superficial”**

13:00 Mesa Redonda y Fin de Curso

14:00 Comida

